

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-083943  
 (43)Date of publication of application : 26.03.1999

(51)Int. Cl. G01R 31/26  
 H01L 21/66  
 H05K 13/04

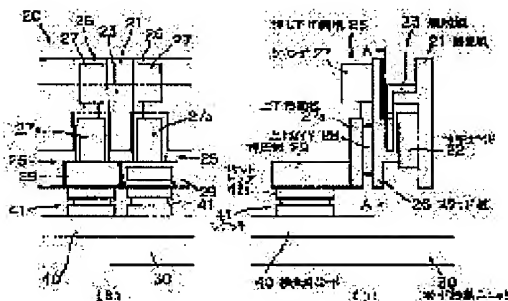
(21)Application number : 09-240801 (71)Applicant : NEC CORP  
 (22)Date of filing : 05.09.1997 (72)Inventor : NUMATA TORU

## (54) PULL-IN, OUT APPARATUS FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable simultaneous insertion and detachment of a plurality of devices to be inspected and at the same time decrease an exchange work consequent to changing in kind of an inspection board.

SOLUTION: An opening closing unit 2 for opening, closing a contact pin of a socket 41 mounted to an inspection board 40 has a plurality of depression mechanisms 25. The depression mechanism 25 has a slide plate 26 guided slidably in a horizontal direction by a horizontal guide 22 set at a fixed plate 21, a pressing part 29 pressing down a frame member 41a of the socket 41 thereby opening the contact pin, and a slider 27 driving the pressing part 29. A regulating plate 23 where a recessed part holding both side parts of the slide plate 26 is formed in accordance with an arrangement position of the socket 41 is detachably set to the fixed plate 21, thereby regulating a position of the depression mechanism 25.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 05.09.1997  
 [Date of sending the examiner's decision of rejection] 15.11.2000  
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
 [Date of final disposal for application]  
 [Patent number]  
 [Date of registration]  
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]  
 [Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-83943

(43) 公開日 平成11年(1999) 3月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I	
G 0 1 R 31/26		G 0 1 R 31/26	Z
H 0 1 L 21/66		H 0 1 L 21/66	J
H 0 5 K 13/04		H 0 5 K 13/04	D
			A

審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号	特願平9-240801	(71) 出願人	000004237
(22) 出願日	平成9年(1997) 9月5日		日本電気株式会社
			東京都港区芝五丁目7番1号
		(72) 発明者	沼田 徹
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(74) 代理人	弁理士 若林 忠 (外4名)

(54) 【発明の名称】 半導体デバイス押抜機

(57) 【要約】

【課題】 複数個の被検査デバイスを同時に挿入および抜去可能な構成としつつも、検査用ボードの種類の変更に伴う交換作業を低減する。

【解決手段】 検査用ボード40に実装されたソケット41のコンタクトピンを開閉するための開閉ユニット20は、複数の押し下げ機構25を有する。押し下げ機構25は、固定板21に設けられた水平ガイド22により水平方向に摺動自在に案内されるスライド板26と、ソケット41の枠部材41aを押し下げることでコンタクトピンを開く押圧部29と、押圧部29を駆動するシリンダ27とを有する。固定板21には、スライド板26の両側方を挟む凹部がソケット41の配置位置に応じて形成された規制板23が着脱自在に設けられ、これにより押し下げ機構25の位置が規制される。

